Реверсивные зависимости диэлектрической проницаемости в сегнетокерамике x PZN-(1-x)PSN

© А.И. Бурханов, А.В. Алпатов, А.В. Шильников, К. Борманис*, А. Калване*, М. Дамбекалне*, А. Штернберг*

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 400074 Волгоград, Россия

* Институт физики твердого тела Латвийского университета, LV-1063 Рига, Латвия

E-mail: postmaster@vgasa.ru

Изучено влияние смещающих полей $E_=$ на диэлектрический отклик сегнетоэлектрического твердого раствора xPZN-(1-x)PSN при x=0, 0.05, 0.2 и 0.5 для температур, которые соответствовали различным областям размытого фазового перехода для каждого состава xPZN-(1-x)PSN. Сделан вывод о том, что увеличение концентрации PZN в данной системе приводит к уменьшению температурной области существования релаксорной фазы.

Работа выполнена при поддержке гранта "Ведущие научные школы" (НШ-1514.2003.2).

PACS: 77.84.Dy, 77.80.Dj

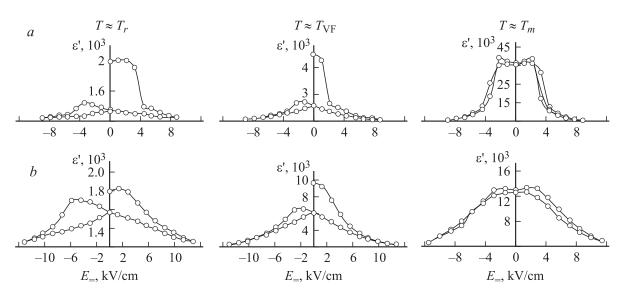
1. Введение

Известно [1,2], что оба компонента сегнетоэлектрического твердого раствора цинкониобата-скандониобата свинца [xPZN-(1-x)PSN] являются релаксорами. Такие материалы обладают высокой восприимчивостью к различного рода внешним воздействиям, что делает их актуальными как в прикладном плане, так и в фундаментальном. Ранее в [3,4] были проведены исследования сегнетокерамики xPZN-(1-x)PSN в сильных переменных полях, что позволило выявить некоторые особенности диэлектрического отклика данной системы. Цель настоящей работы — изучение влияния смещающих полей E_- на диэлектрический отклик системы xPZN-(1-x)PSN

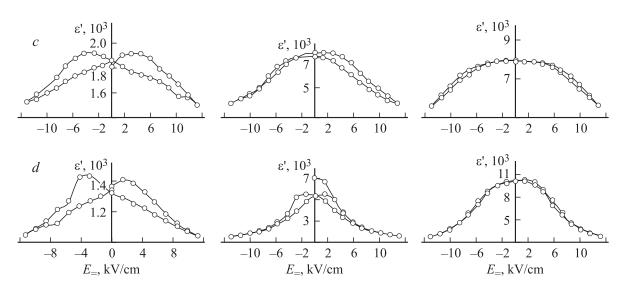
при различных соотношениях компонент и в широкой области температур, включающей температуры размытого фазового перехода.

2. Экспериментальные результаты и обсуждение

Сегнетоэлектрический твердый раствор x PZN-(1-x) PSN при x=0, 0.05, 0.2, 0.5 изготавливался по обычной керамической технологии. Образцы для диэлектрических измерений представляли собой пластины размером 4×4 mm различной толщины (d=0.7-0.9 mm). Электроды наносились методом вжигания серебряной пасты. Измерения реверсивных



Реверсивные зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon_r'(E_-)$ в сегнетокерамике xPZN-(1-x)PSN для составов с x=0 (a), 0.05 (b), 0.2 (c), 0.5 (d) соответственно в трех температурных областях: при комнатной температуре T_r , температуре Фогеля—Фулчера $(T_{\rm VF})$ и температуре вблизи T_m для соответствующего состава.



Продолжение рисунка.

зависимостей диэлектрической проницаемости $\varepsilon_r'(E_=)$ проводились мостовым методом на частоте 1000 Hz при ступенчатой подаче смещающего поля (E_{-}) .

Рисунок иллюстрирует поведение реверсивных зависимостей $\varepsilon'_r(E_=)$ для концентраций x=0 (a), 0.05 (b), 0.2~(c) и 0.5~(d) в трех температурных областях: для комнатной температры T_r , которая была существенно ниже T_m (T_m — температура максимума $\varepsilon_r'(T)$) при всех значениях x, для $T \approx T_{\rm VF}$ ($T_{\rm VF}$ — температура Фогеля— Фулчера для каждого состава) и для $T \approx T_m$ соответствующего состава. Из рисунка видно, что для некоторых концентраций x значения ε'_r при $E_==0$, полученные в начале измерений ε_r' , значительно превышают значения ε_r' , которые имеет материал после переполяризации. Данное различие оценивалось в настоящей работе по величине $h=(arepsilon_{
m st}'-arepsilon_{
m end}')/arepsilon_{
m st}'\cdot 100\%$, где $arepsilon_{
m st}'=arepsilon_{
m r}'(E_=)$ при $E_{=}=0$ до начала реверсирования, $arepsilon_{ ext{end}}'=arepsilon_{r}'(E_{=})$ при $E_{=}=0$ после реверсирования. Наибольшее значение hпри $T = T_r$ наблюдается у составов с x = 0 (32.6%) и 0.05 (12.2%). Данное различие в характере воздействия $E_{=}$ можно объяснить тем, что в материалах с x=0и 0.05 до приложения $E_{=}$ имеет место гетерофазная структура (сосуществование полярной и неполярной фаз). В этом случае большой вклад в ε_r' вносят фазовые границы между полярной и неполярной фазой. После воздействия $E_{=}$ бо́льшая часть фазовых границ исчезает вследствие индуцирования полярной (сегнетоэлектрической) фазы во всем объеме образца. В этом случае дальнейший отклик материала будет определяться поведением лишь доменной структуры. В составах же с x = 0.2 и 0.5 при T_r , где h мало (1.3 и 1.6% соответственно) достаточно устойчивая сегнетоэлектрическая фаза, вероятнее всего, существует и до воздействия $E_{=}$, что позволяет считать температурный интервал существования релаксорной фазы для x = 0.2 и 0.5 более узким, чем для x = 0 и 0.05. Результаты настоящей работы хорошо согласуются с данными и выводами, представленными в [3], где, в частности, было выявлено уменьшение интервала $(T_m - T_{VF})$ при концентрации x = 0.2.

Список литературы

- [1] Ю.Н. Веневцев, С.А. Политова, С.А. Иванов. Сегнето- и антисегнетоэлектрики семейства титаната бария. Химия, M. (1985). 258 c.
- [2] S. Wada, S.-E. Park, L.E. Cross, T.R. Shrout. Korean Phys. Soc. **32**, February, 1290 (1998).
- А.И. Бурханов, А.В. Шильников, А.В. Алпатов, К. Борманис, А. Штернберг, А. Калване. Матер. Междунар. научнопрактической конф. "Фундаментальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения". М. (2003). С. 115.
- А.И. Бурханов, А.В. Алпатов, А.В. Шильников, К Борманис, А. Штернберг, А. Калване, М. Дамбекалне. INTERMATIC-2004. Матер. Междунар. научно-практической конф. "Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения". МИРЭА — ЦНИИ "Электроника", М. (2004). Часть 1. С. 81.